

ENERGIE, TELECOMMUNICATIONS, SIGNAL, COMPOSANTS, AUTOMATISMES, INFORMATIQUE...

DOSSIER :

Les multiples facettes de l'instrumentation

Ref: PF 120201/05 Df: 2996749-
REVUE DE L'ELECTRICITE & DE L'ELECTRONIQ
01.01.01 Vol: 2001 No. 1
1265-6534 22101144 29.10.01
LIBRIS - C2
144 BOULEVARD KRIM BELKACEM
ALGER
ALGERIE

INVITÉ

P. 6

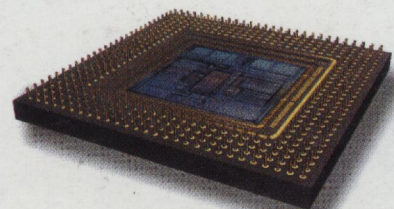
- Les radiotélescopes :
technologies et mises
en œuvre



INDUSTRIE ET MARCHÉS

P. 12

- La CEM des circuits
intégrés



- GE Power Controls
souhaite globaliser son offre
- Le PXI s'affiche
comme une solution
de test universelle

FORMATION

P. 22

- Le LEP fête ses 50 ans

NORMES

P. 25

- EDF s'engage
dans la HQE

REPÈRES :

Transmissions haut débit sur paire téléphonique

Sommaire

REE
REVUE DE
L'ELECTRICITE
ET DE
L'ELECTRONIQUE



N° 1/2001 - Janvier

Editorial par Dominique Placko 1

Calendrier 4

Invité 6

Industrie et marchés 12

Formation, recherche, emploi 22

Régions 24

Normes et qualité 25

Revue de presse 27

Publications 28

Nouveaux produits 29

Dossier 32

Les multiples facettes de l'instrumentation

Résumés/Abstracts 71

Repères 74

Transmissions à haut débit sur paire téléphonique

En direct avec la SEE 98

Service lecteurs 100

En couverture : document SIEMENS.

DOSSIER

Les multiples facettes de l'instrumentation

Activité incontournable et interdisciplinaire, l'instrumentation est présente dans toutes les industries de production, dans les sciences pour l'ingénieur, les sciences de base, en médecine, etc. Elle relie les phénomènes physico-chimiques aux perceptions humaines et de ce fait s'appuie sur les techniques de pointe dans des domaines aussi variés que les capteurs et la mesure, les technologies de la communication, le traitement des signaux et de l'information. Les articles que nous vous présentons vous offrent un aperçu des multiples applications de cette activité.



Avant-propos par Daniel Estève 32

Présentation par François Lepoutre 34

Enseigner la mesure et l'instrumentation : quelques éléments de réflexion par Michel Robert 36

Précision des mesures par interférométrie de speckle, application à des composants aéronautiques par Pascal Picart, Nicolas Joly, Jean-Marc Breteau, Jean-Claude Pascal 36

Imagerie tomographique et topographique par microscopie interférentielle par L. Vabre, A. Dubois, E. Beaurepaire, J.L. Stéhlé, A.C. Boccara 45

Capteur thermique destiné à la validation des modèles de propagation des feux de forêts par Khaled Chetehouna, Alain Degiovanni, Olivier Séro-guillaume 49